2019/1/28 2回 シンクロトロン光産業利用セミナー ウインクあいち

小角X線散乱技術入門と ソフトマテリアルの構造解析実施例

名古屋工業大学大学院工学研究科 生命・応用化学専攻 山本勝宏 yamamoto.katsuhiro@nitech.ac.jp

X線小角散乱が対象とするもの

- 1. 平均粒径や平均粒子間距離の長さ情報を高精度で得られる。対象サイズは数nm~数100nmが一般的。(大きさ・形状・周期長・相関長)
- 2. 数10µ~数100µ(金属) 数µ~数mm(高分子)
 厚の試料を非破壊で測定
- 3. 放射光X線
 - 1. 輝度が高い(微小試料、超薄膜)
 - 2. 時間分割(その場観察)
 - 3. 波長可変(異常分散など)

X線小角散乱が対象とするもの

- 電磁波(光・X線)は電子によって散乱
 屈折率差・電子密度差(コントラスト)を考える
 コントラストがなければ観測されない
 コントラストの空間分布 → 構造
- 2. 観測対象の粒子や構造の大きさが数nmから数10nm
 3. 散乱プロファイル(散乱強度 Iの散乱角(2θ)依存性)



10nmの大きさを測定 波長を 0.1nmのX線

散乱角は 0.513°程度となる (0.01ラジアン)

X線小角散乱が対象とするもの

 1. 電磁波(光・X線)は電子によって散乱 屈折率差・電子密度差(コントラスト コントラストがなければ観測されない コントラストの空間分布 → 7

2. 観測対象の粒子や構造の大きさが数nn 3. 散乱プロファイル(散乱強度Iの散乱角(



10nmの大きさを測定 波長を 0.1nmのX線

散乱角は 0.513°程度となる (0.01ラジアン)



小角散乱



$$E_{s}(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}}(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{p}} f_{\mathbf{p}} \{ \exp[-i(\omega t + \mathbf{q} \cdot \mathbf{r})] \} E_{i}$$

$$= E_{i} \exp(-i\omega t) \sum_{\mathbf{p}} f_{\mathbf{p}} \exp(-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) \quad$$
構造振幅
$$= \left(\frac{E_{i}}{R_{D}}\right) \exp(-i\omega t) F_{s}(\mathbf{q}) \qquad F_{s}(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{p}} p_{\mathbf{p}} \exp(-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}), \quad p_{\mathbf{p}} \equiv R_{D} f_{\mathbf{p}}$$
強度
$$I_{s}(\mathbf{q}) = \left(\frac{I_{i}}{R_{D}^{2}}\right) |F_{s}(\mathbf{q})|^{2} \qquad F_{s}(\mathbf{q}) = \int p(\mathbf{r}) \exp(-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}) d\mathbf{r} \qquad$$
積分系

自己相関関数

散乱強度

5

構造と実験データの関係



孤立粒子による散乱(希薄系)

半径20nmの球状粒子(孤立)からの散乱曲



7

たんぱく質などの慣性半径



慣性半径R_gは蛋白質などの形状を示す重要な指標 同じ分子量でも形が球形からずれるとR_gは大きくなる (体積一定の際、最も小さなR_gを与えるが球)

球の半径R

$$R_g = \sqrt{3/5} R$$





散乱体の形状に依存した散乱 Rod, Disk



粒子内干渉(形状因子)によるピーク(広角側の振動)

半径Rの球 $q_{m,i}R = 5.765, 9.111, 11.22 (i = 1,2,3, \cdots)$ 半径Rの棒 $q_{m,i}R = 4.98, 8.364, 11.46 (i = 1,2,3, \cdots)$

厚みhの板

 $q_{m,i}h =$ **8.76, 15.14, 21.61** (i =**1,2,3,** \cdots)

形状に関して現れるべき乗則

棒(Rod, Cylinder, Fiber) *L*⁻¹ << q << R⁻¹ において *I*(q)~q¹

円盤(Disk, Plate, Lamellae) *R*⁻¹ << *q* << *h*⁻¹ において *I*(*q*)~*q*²

マスフラクタル 距離r中に含まれる質量M $M \sim r^{d_M}$ d_M マスフラクタル次元

マスフラクタル次元の散乱関数 *I(q)~q^{-d}^M* J. Martin et al., *J.Appl.Cryst.* 20, 61, 1987 9

孤立粒子による干渉 or/and 粒子間干渉







ミセル

粒子・フィラー・繊維分散系

その他

結晶-非晶ラメラ 相分離構造 架橋による不均一構造 その他





実際の小角X線散乱パターン



2-次元 SAXS パターン









- 1. 低温結晶化ではメゾ(スメクチック)相が形成
- 2. 高温結晶化でit-PPに典型的なa型結晶形成

3. 結晶化温度上昇とともに散乱強度およびドメイン間距離増加

ゴム充填系の階層構造





ポリイソプレンゴムを溶媒で膨潤させて測定 不均一性を議論する



系内に存在する不均一構造 (濃度不均一性:濃度揺らぎ)



観測しているコントラストは、高分子と溶媒で考える

第一項

Debye-Bueche関数:ランダムな二相系 相関長の不均一性が存在する(何かは不明)

第二項

Debye-Bueche関数:ランダムな二相系 架橋の粗密(架橋度の高い領域と低い領域)

第三項

Ornstein-Zernike-Debye関数:高分子鎖の網目 網目のメッシュサイズ



ポリイソプレンゴムを溶媒で膨潤させて測定 不均一性を議論する



系内に存在する不均一構造 (濃度不均一性:濃度揺らぎ)



観測しているコントラストは、高分子と溶媒で考える

第一項

Debye-Buech関数:ランダムな二相系 相関長の不均一性が存在する(何かは不明)

第二項

Debye-Buech関数:ランダムな二相系 架橋の粗密(架橋度の高い領域と低い領域)

第三項

Ornstein-Zernike-Debye関数:高分子鎖の網目 網目のメッシュサイズ

コントラスト変調法によるバウンドラバーの存在



X線散乱法では

シリカ(或いはCB)充填系では、シリカの電子密度が高く バウンドラバーとマトリックスは同じ高分子のため電子密度差は小さく シリカ充填系では観測が困難

中性子散乱法(電子密度コントラストではなく原子核による散乱能の違いを利用: 散乱能とはX線でいうところの電子密度)



Recent Soft Contact Lens



O₂ H₂O

水で膨潤した状態の構造



Model Calculation



セルロースナノファイバー





高分子64, p85 (2015) 2月号 磯貝明



透過型電子顕微鏡

ネガティブ染色法 JEOL-1400plus 加速電圧 100kV

TEMPO酸化 CNF



Rheo-crystal 水分散CNF (1%) 繊維半径 2.0nm (標準偏差 0.5nm) 繊維が孤立的に分散している状態と考えられる 棒の散乱関数 $P(q) = A \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{2J_{1}(qR\sin\alpha)}{qR\sin\alpha} \frac{\sin(qH\cos\alpha)}{qH\cos\alpha} \right]^{2}$ $\sin \alpha d \alpha$ **2**H **2**R J₁ 1次ベッセル関数 散乱ベクトルとシリンダー軸のなす角 α

CNF分散樹脂



ブロック共重合体ミセル

・親水性ブロックと疎水性ブロックで構成される両親媒性ジブロック共重合体は 片方の成分に選択的な溶媒中でミセルを形成

・ミセルの形状は両ブロック間の偏斥力、体積分率に応じて変化 ex). 球状ミセル、紐状ミセル、円盤状ミセル etc.



Hydrophilic head - Hydrophobic tail



Core-Shell Sphere Model



Synthesis of Block Copolymer

リビングアニオン重合によりPolystyrene-b-poly(2-vinylpyridine)(S2VP)を合成



Sample	<i>M</i> _n	M _w	PDI	f _{PS}
S2VP	$1.96 imes 10^4$	$2.61 imes 10^4$	1.33	0.34

P2VPブロックの四級化(親水化) $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \uparrow n$ DMF product (親水化)rel + rel +

Sample	Quaterniza	Volume	
	Butyl Bromide	Hydrogen Bromide	Fraction (Vol.%)
PS			33
qP2VP	0%	100%	67

Preparation of the Micelles

5wt.% のミセル溶液を調製した後 1wt.% に希釈して試料を作成 ➡ミセルの形成条件を全てのサンプルで統一



1wt.% (H₂O:THF = 8 : 2) 1wt.% (H₂O:THF = 6 : 4) 1wt.% (H₂O:THF = 4 : 6) 29

Dynamic Light Scattering

流体力学的半径R_h



THFの増加につれてミセルの流体力学的半径が減少 →ミセルの半径が小さくなっている

SAXS Profiles



31

Core-Shell Sphere Model







SAXS Profiles



Fitting Parameter



H ₂ O	:THF	8:2	6:4	4:6
R _C ((nm)	8.9	7	6.9
R _s - R	_c (nm)	15.2	11.7	3.6
ł	C	1.8	1.8	1.8
<i>f</i> _C (vol.%)		70	48	29
N _{agg}		211	71	41
$ ho_{\rm core}$	(mol/cm ³)	0.543	0.527	0.514
$ ho_{ m corona}({\sf R}_{\sf C}) \ ({\sf mol/cm}^3)$		0.552	0.539	0.550
$ ho_{ m solvent}$	(mol/cm ³)	0.541	0.529	0.529

Mobility of PS chain

NMR spectra in dTHF/D₂O



PS coreにおけるTHFとの割合

D ₂ O:THF	v _{PS} (vol.%)	w _{PS} (wt.%)	<i>Т</i> * (°С)
4:6	29	<u>33</u>	-38
6:4	48	<u>52</u>	0.5
8:2	70	<u>73</u>	45
$T_{g,PS} =$	100	$T_{\rm m,THF}$ =	= -108

 $T^* = w_{PS}T_{g,PS} + (1 - w_{PS})T_{m,THF}$ PS coreの体積分率 v_{PS} 重量分率 w_{PS} 観測温度は室温(20℃程度)

35

重水中およびdTHF 20%溶媒ではPSピークなし
 THFの増加に伴いPSのベンゼン環のピークが先鋭化
 → PS鎖の運動性向上
 → PSコアにTHFが取り込まれている

異常分散効果を利用した斜入射小角X線散乱法による 多成分系高分子材料の構造解析

Anomalous Small Angle X-ray Scattering



ASAXSとGISAXSを組み合わせたAGISAXSによって 多成分系高分子薄膜の構造解析を行う

Samples : Where Br-PHS is located?



Polymer	$M_{ m n}$	PDI	$f_{ m PS}$
PS-b-PHS	4.76×10^{4}	1.06	0.84
Br-PHS	2.8×10^{3}	2.07	

Blend ratio PS:PHS:Br-PHS=75:12.2:12.8

 Solubility Parameters d (cal/cm³)^{1/2} 文献値

 PS 8.3-9.3 PHS 10.44 – 12 BrPHS 8.81 – 9.2

 Tol 8.8 THF 9.1 Methanol 14.5

Experimentally obtained using THF, Hexane, and Water



原子散乱因子の波長依存性



1D SAXS Profile / Morphology



1D SAXS Profiles



Analytical Model













Conclusion





さいごに

- SAXS法と電子顕微鏡法などと相補的利用により確度の高い構造解 析が可能
 - ポイント
 - サイズ、コントラスト
 - 孤立(希薄)系? バルク(濃厚)系?
 - 特長は
 - 非破壊解析、空間的平均(統計精度が高い)
 - 経時変化も追跡可能(数µ秒から)
 - 温度・圧力・雰囲気違いなど環境変化依存性
 - 波長可変(現選択的な解析が可能)